

A Long Title



Tobias Schlosser | What? | When?, Where?

Abstract

OREM ipsum (...). See Schlosser, Friedrich, Beuth, and Kowerko (2022).

Images

References

Schlosser, T., Friedrich, M., Beuth, F., & Kowerko, D. (2022). Improving automated visual fault inspection for semiconductor manufacturing using a hybrid multistage system of deep neural networks. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 33(4), 1099-1123.

Acknowledgment









Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.